

Тема 4. Апостериорные алгоритмы обнаружения изменения свойств случайного процесса

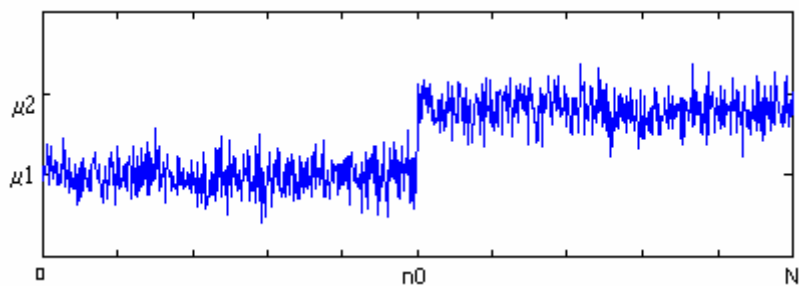
По способу получения информации об объекте диагноза различают апостериорный и последовательный анализ.



Типы дефектов

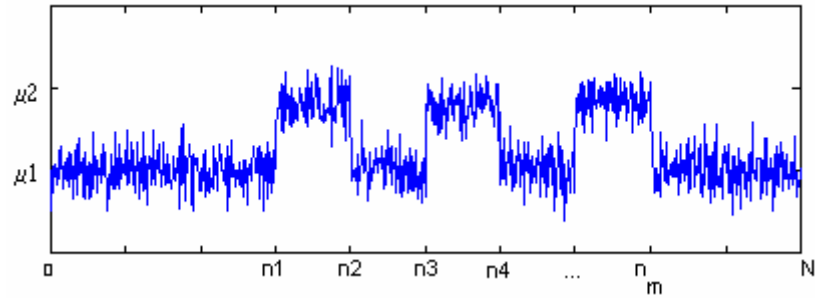
Дефект 1: однократное скачкообразное изменение математического ожидания.

$$\begin{cases} z(n) \in N(m_1, b_1), n \in [0, n_0] \\ z(n) \in N(m_2, b_1), n \in [n_0 + 1, N] \end{cases}$$



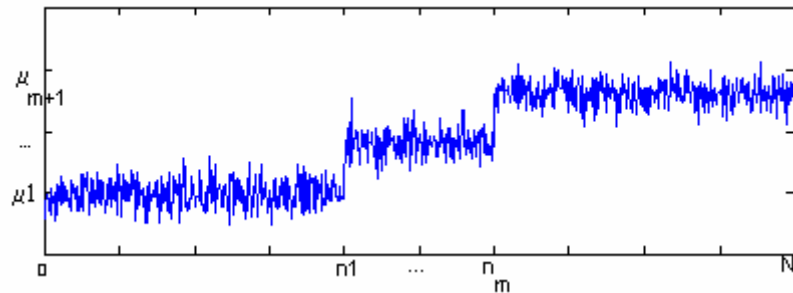
Дефект 2: восстанавливаемое скачкообразное изменение математического ожидания.

$$\begin{cases} z(n) \in N(m_1, b_1), n \in [0, n_1] \\ z(n) \in N(m_2, b_1), n \in [n_1 + 1, n_2] \\ z(n) \in N(m_1, b_1), n \in [n_2 + 1, n_3] \\ z(n) \in N(m_2, b_1), n \in [n_3 + 1, n_4] \\ \mathbf{L} \\ z(n) \in N(m_1, b_1), n \in [n_m + 1, N] \end{cases}$$



Дефект 3: неоднократное скачкообразное изменение математического ожидания.

$$\begin{cases} z(n) \in N(m_1, b_1), n \in [0, n_1] \\ z(n) \in N(m_2, b_1), n \in [n_1 + 1, n_2] \\ z(n) \in N(m_3, b_1), n \in [n_2 + 1, n_3] \\ z(n) \in N(m_4, b_1), n \in [n_3 + 1, n_4] \\ \mathbf{L} \\ z(n) \in N(m_{m+1}, b_1), n \in [n_m + 1, N] \end{cases}$$



Дефект 4: однократное плавное изменение математического ожидания.

$$\begin{cases} z(n) \in N(m_1, b_1), n \in [0, n_0] \\ z(n) = g(n) + \frac{m_2 - m_1}{\Delta} (n - n_0), g(n) \in N(0, b_1), n \in [n_0, n_0 + \Delta] \\ z(n) \in N(m_2, b_1), n \in [n_0 + \Delta, N] \end{cases}$$

Апостериорные алгоритмы

1. Алгоритм, использующий статистику Манна-Уитни

Обнаруживает: дефект 1.

Алгоритм, использующий статистику Манна-Уитни [1]:

$$t_{ik} = \begin{cases} 1, & z_i \geq z_k \\ 0, & z_i < z_k \end{cases}$$

$$G(n) = \frac{\sum_{k=n+1}^N \sum_{i=1}^n t_{ik}}{n(N-n)}$$

$$\hat{n}_0 = \arg \min_{[aN] \leq n \leq [N-aN]} G(n), \quad m_1 < m_2$$

$$\hat{n}_0 = \arg \max_{[aN] \leq n \leq [N-aN]} G(n), \quad m_1 > m_2$$

\hat{n}_0 – оценка момента возникновения дефекта.

2. Общий случай алгоритма Бродского-Дарховского

Общий случай алгоритма Бродского-Дарховского [2]:

$$Y(n) = \left[\frac{n}{N} \left(1 - \frac{n}{N} \right) \right]^n \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i - \frac{1}{N-n} \sum_{i=n+1}^N z_i \right)$$

$$0 \leq n \leq 1,$$

$$\hat{n}_0 = \arg \max_{[aN] \leq n \leq [bN]} |Y(n)|,$$

$$0 < a < \frac{1}{2} < b < 1$$

\hat{n}_0 – оценка момента возникновения дефекта.

Асимптотически наилучший метод в смысле вероятности ложных обнаружений:
 $n = 1$.

Асимптотически наилучший метод в смысле вероятности ложного спокойствия:
 $n = 0$.

Асимптотически минимаксный метод: $n = \frac{1}{2}$.

3. Алгоритм Бродского-Дарховского №1

Обнаруживает: дефект 1, дефект 2.

Алгоритм Бродского-Дарховского №1 [5] ($n = 1$):

$$Y(n) = \frac{n}{N} \left(1 - \frac{n}{N} \right) \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i - \frac{1}{N-n} \sum_{i=n+1}^N z_i \right),$$

$$G = \max_{1 \leq n \leq N-1} |Y(n)|,$$

$G < h \Rightarrow$ дефекта нет,

$G \geq h \Rightarrow$ есть дефект,

где $h > 0$ – порог срабатывания.

По функции $Y(n)$ строится функция $T^{(1)}(n)$, на её основе – множества $A_i^{(1)}(n)$, исходя из которых получаются оценка количества моментов возникновения дефектов \tilde{k} и оценки моментов возникновения дефектов $\hat{n}_1, \hat{n}_2, \dots, \hat{n}_{\tilde{k}}$:

$$\left\{ \begin{array}{l} T(n) = Y(n + [eN]) - Y(n), 0 < e < \frac{d}{4} \\ \hat{n}_1 = \begin{cases} \min A_1, A_1 \neq \emptyset \\ N, A_1 = \emptyset \end{cases}, \\ \text{где } A_1 = \{n \geq 1 : \text{sign}(T(n)) \neq \text{sign}(T(n+1))\} \\ \hat{n}_i = \begin{cases} \min A_i, A_i \neq \emptyset \\ N, A_i = \emptyset \end{cases}, \\ \text{где } A_i = \{n \geq \hat{n}_{i+1} + [dN/2] : \text{sign}(T(n)) \neq \text{sign}(T(n+1))\}, \\ i = 2.. \tilde{k} \\ \tilde{k} = \min \{s : \hat{n}_s = N\} - 1 \end{array} \right.$$

4. Алгоритм Бродского-Дарховского №2

Обнаруживает: дефект 1, дефект 2, дефект 3.

Алгоритм Бродского-Дарховского №2[3, 4]:

$$Y(n) = \frac{n}{N} \left(1 - \frac{n}{N} \right) \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i - \frac{1}{N-n} \sum_{i=n+1}^N z_i \right),$$

$$G = \max_{1 \leq n \leq N-1} |Y(n)|,$$

$G < h \Rightarrow$ дефекта нет,

$G \geq h \Rightarrow$ есть дефект,

где $h > 0$ – порог срабатывания.

По функции $Y(n)$ строится функция $T^{(2)}(n)$, на её основе – множества $A_i^{(2)}(n)$, исходя из которых получаются оценка количества моментов возникновения дефектов \tilde{k} и оценки моментов возникновения дефектов $\hat{n}_1, \hat{n}_2, \dots, \hat{n}_{\%}$:

$$\left| \begin{array}{l} T(n) = Y(n + [eN]) - 2Y(n) + Y(n - [eN]), 0 < e < \frac{d}{4} \\ \hat{n}_1 = \begin{cases} \min A_1, A_1 \neq \emptyset \\ N, A_1 = \emptyset \end{cases}, \\ \text{где } A_1 = \{[dN] \leq n < N - [dN] : |T(n)| > 4eh\} \\ \hat{n}_i = \begin{cases} \min A_i, A_i \neq \emptyset \\ N, A_i = \emptyset \end{cases}, \\ \text{где } A_i = \{\hat{n}_{i+1} + [dN/2] \leq n < N - [dN] : |T(n)| > 4eh\}, i = 2.. \% \\ \% = \min\{s : \hat{n}_s = N\} - 1 \end{array} \right.$$

5. Алгоритм Дарховского

Обнаруживает: дефект 4, дефект 1 (при $\Delta = 1$).

Алгоритм Дарховского [6]:

Пусть z_j принимает значения $a_1 \mathbf{K} a_k$.

Тогда, если Δ известна:

$$Y(n) = \sum_{j=1}^k \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_j(i) - \frac{1}{N - n - \Delta} \sum_{i=n+\Delta+1}^N x_j(i) \right)^2,$$

$$x_j(i) = \begin{cases} 1, z'_i = a_j \\ 0, z'_i \neq a_j \end{cases},$$

z'_i – значение сигнала z_i , «округленное» до ближайшего уровня $a_1 \mathbf{K} a_k$

Анализируя максимум $Y(n)$, определяется оценка момента возникновения дефекта \hat{n}_0 :

$$\left| \begin{array}{l} M = \left\{ \arg \max_{a \leq t \leq b} Y(tN) \right\} \\ 0 < a \leq \frac{n_0}{N} \leq \frac{n_0 + \Delta}{N} \leq b < 1 \\ \hat{q}_0 \in M \\ \hat{n}_0 = \hat{q}_0 \cdot N \end{array} \right.$$

Если Δ неизвестна, то все намного сложнее.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Дарховский Б.С. Непараметрический метод для апостериорного обнаружения момента “разладки” последовательности независимых случайных величин // Теория вероятностей и ее применения. – 1976. – т.21, №1. – с. 180-184.
2. Бродский Б.Е., Дарховский Б.С. Асимптотический анализ некоторых оценок в апостериорной задаче о разладке // Теория вероятностей и ее применения. – 1990. – т.35, №3. – с. 551-557.
3. Бродский Б.Е., Дарховский Б.С. Алгоритм апостериорного обнаружения многократных разладок случайной последовательности // Автоматика и телемеханика. – 1993. – №1. – с. 62-67.
4. Бродский Б.Е., Дарховский Б.С. Проблемы и методы вероятностной диагностики // Автоматика и телемеханика. – 1999. – №8. – с. 3-50.
5. Бродский Б.Е., Дарховский Б.С. Непараметрический метод обнаружения моментов переключения двух случайных последовательностей // Автоматика и телемеханика. – 1989. – №10. – с. 66-74.
6. Дарховский Б.С. Общий метод оценивания момента изменения вероятностных характеристик случайной последовательности // Статистические проблемы управления. – 1984. – вып.65. – с. 76-82.